

оказывают влияния на наблюдаемую термоэдс при условии, что поверхности раздела не являются заряженными и не сорбируют молекуля инородных примесей, которые могут давать вклад в суммарную термоэдс поликристалла.

Таким образом, термоэдс поликристаллических графитов в большинстве практически важных случаев определяется величиной α_1 .

Л и т е р а т у р а

- [1] Blackman L. C. F., Dundas P. H., Ubbelohde A. R. // Proc. Roy. Soc. (London). 1960. V. 255. N 1282. P. 293—306.
- [2] Blackman L. C. F., Saunders G., Ubbelohde A. R. // Proc. Roy. Soc. (London). 1961. V. A264. N 1316. P. 19—40.
- [3] Оделевский В. И. // ЖТФ. 1951. Т. 21. № 11. С. 1379—1382.
- [4] Stroud D. // Phys. Rev. 1975. V. B12. N 2. P. 3368—3373.
- [5] Айрапетянц С. В. // ЖТФ. 1957. Т. 27. № 3. С. 478—483.

НИИграфит
Москва

Поступило в Редакцию
13 июля 1988 г.

УДК 538.945

Физика твердого тела, том 31, в. 1, 1989

Solid State Physics, vol. 31, N 1, 1989

О ПРИРОДЕ СВЧ ПОГЛОЩЕНИЯ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКЕ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, В СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

А. С. Хейфец, А. И. Вейнгер, А. Г. Забродский,
С. В. Казаков, М. П. Тимофеев

1. В металлооксидных керамиках систем $\text{Me}-\text{Ba}(\text{Sr})-\text{Cu}-\text{O}$ ($\text{Me} : \text{La}, \text{Y}$ и др.) в сверхпроводящем состоянии было обнаружено существенное изменение СВЧ поглощения в слабых магнитных полях [1—3]. Эффект качественно объясняли переходом из мейсснеровского состояния в смешанное [1] или же свойствами керамики как макроскопической джозефсоновской среды [2, 3]. Мы приводим здесь доказательства в пользу первой точки зрения, основываясь на изучении магнитополевой и температурной зависимости эффекта. Переход в смешанное состояние в слабых полях $H \ll H_{c1}$ оказывается возможен благодаря резкому увеличению поля на поверхностных неоднородностях керамического образца [4]. Возникающее при этом СВЧ поглощение обусловлено вязким течением абрикосовских вихрей.

2. Эксперименты выполнялись на образцах керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, полученной обычным процессом помол—прессование—отжиг в двухстадийном варианте. Отжиг проводился в потоке кислорода 0.1 л/мин при 950 °C. Свежеприготовленные образцы имели $T_c = 95$ К при узкой переходной области $\Delta T_c = 0.5$ К.

СВЧ поглощению исследовалось на образцах объемом 1 мм^3 на частоте 9.4 ГГц в ЭПР спектрометре E-112 «Varian» с проточным гелиевым криостатом «Oxford Instruments». Остаточное поле сердечника электромагнита компенсировалось полем постоянного магнита противоположной полярности.

Регистрировался сигнал производной СВЧ поглощения при $T = 80$ К (рис. 1, вставка). Видно, что производная интенсивности поглощения по полю линейна в слабых полях, т. е. зависимая от поля часть поглощения имеет вид $I(H) = \gamma H^2/2$, где коэффициент $\gamma = H^{-1}dI/dH$. Зависимость коэффициента γ от температуры представлена точками на рис. 1. Абсолют-

ная величина поглощения соответствовала приращению поверхностного импеданса $\Delta R = 10^{-6}$ Ом в поле $H = 1$ Э при температуре $T = 4.2$ К.

3. Для интерпретации экспериментальных данных воспользуемся моделью Мелвилла [4], описывающей распределение магнитного поля на шероховатой поверхности сверхпроводника II рода. На рис. 2 приведена

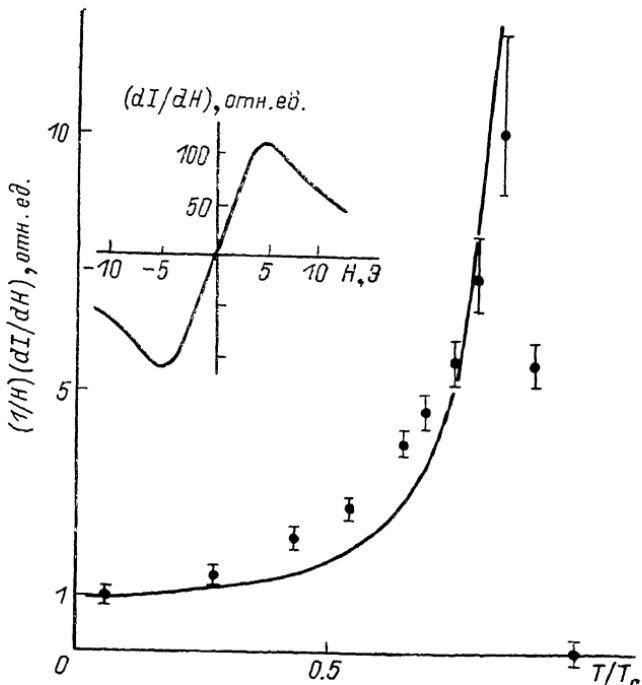


Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента $\gamma = H^{-1} dI/dH|_{H=0}$.

электронная микрофотография поверхности керамического образца, из которой видно, что характерные размеры выступов на поверхности составляют 1–10 мкм. Согласно Мелвиллу, силовые линии магнитного поля вблизи поверхности частично проникают в выступы сверхпроводящего образца (рис. 3). В результате плотность силовых линий, т. е. магнитная индукция, оказывается отличной от нуля в некотором поверхностном слое глубиной, превышающей лондоновскую. Глубина проникновения x_m определяется условием $A(x_m) = H/H_{c1}$, где H — магнитное поле вдали

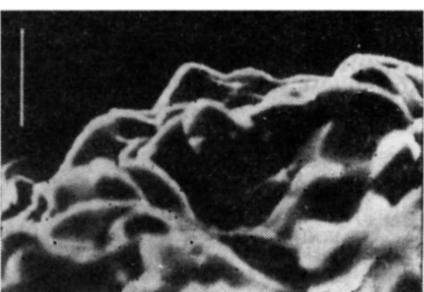


Рис. 2. Электронная микрофотография поверхности керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. Размер метки 10 мкм.

от поверхности. Величина $A(x)$ равна той части длины силовой линии, которая проходит внутри сверхпроводника. При движении от поверхности функция $A(x)$ монотонно возрастает от $A(x=0)=0$ до $A(x \geq h)=1$. Здесь h — высота рельефа поверхности. Последнее условие означает проникновение магнитного поля в толщу образца при $H=H_{c1}$. Из формулы (8) работы [4] следует, что в слабых внешних полях $H \ll H_{c1}$ индукция в приповерхностном слое равна

$$B(x) = H - A(x) H_{c1}, \quad x \ll x_m \ll h. \quad (1)$$

Поток, пронизывающий полосу поверхности единичной ширины, равен

$$\Phi = \int_0^{x_m} B(x) dx = H_{c1} - H_{c1} \int_0^{x_m} A(x) dx. \quad (2)$$

Для поверхности керамического образца, образованной выступающими остройми гранями отдельных микрокристаллов, при $x \ll h$ можно ограничиться линейным приближением для функции $A(x) = x/h$. Поэтому в соответствии с (2) $\Phi = hH^2/2H_{c1}$. Этот поток образован $n = \Phi/\Phi_0$ вихревыми нитями, каждая из которых несет квант потока Φ_0 и дважды пересекает выступ. Если характерное расстояние между выступами равно приблизительно их высоте, то в полосе единичной ширины длиной a на поверхности образца располагается a/h выступов. При этом на боковой грани образца размерами $ab=S$, параллельной внешнему полю, оказывается $N = SH^2/(H_{c1}\Phi_0)$ точек, в которых вихревые нити выходят на поверхность сверхпроводника.

4. В каждой такой точке происходит поглощение СВЧ мощности за

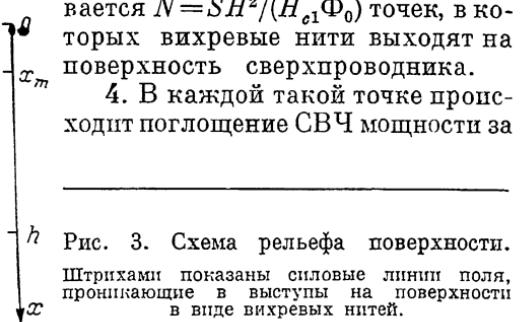
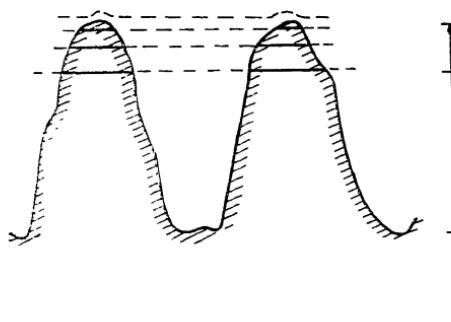


Рис. 3. Схема рельефа поверхности. Штрихами показаны силовые линии поля, проникающие в выступы на поверхности в виде вихревых нитей.

счет вязкого колебательного движения вихря в поле СВЧ волны. Считая частоту достаточно большой, чтобы пренебречь жесткостью вихревой решетки и упругой силой пиннинга, можно вычислить мощность, поглощаемую на единице длины вихря [5] $\delta P = j_\sim \Phi_0 / (2\sigma_n H_{c2})$, где $j_\sim = (c/4\pi)\text{rot } H_\sim$ — плотность тока, индуцированного СВЧ волной; σ_n — удельная электропроводность в нормальном состоянии. Считая закон проникновения поля в сверхпроводник экспоненциальным и интегрируя по длине вихря, получаем поглощаемую на нем мощность

$$P = \frac{c^2}{(8\pi)^2} \Phi_0 \frac{1}{\lambda \sigma_n} \frac{H_\sim^2}{H_{c2}^2}. \quad (3)$$

Здесь λ — глубина проникновения поля в сверхпроводник, H_\sim — амплитуда СВЧ магнитного поля на поверхности. Умножая (3) на число вихрей, получаем мощность, поглощаемую на единице поверхности сверхпроводника

$$P/S = \frac{c^2}{(8\pi)^2} \frac{H^2}{H_{c1} H_{c2}} \frac{H_\sim^2}{\lambda \sigma_n}. \quad (4)$$

Отсюда поверхностный импеданс в магнитном поле равен

$$R(H) = \frac{H^2}{2H_{c1} H_{c2}} \frac{1}{\lambda \sigma_n} = \frac{H^2}{2H_{c1} H_{c2}} \frac{\delta}{\gamma} R_n, \quad (5)$$

где $\delta = c/(2\pi\omega\sigma_n)^{1/2}$ — глубина проникновения, $R_n = (2\pi\omega/c^2\sigma_n)^{1/2}$ — поверхностный импеданс в нормальном состоянии.

Формула (5) объясняет квадратичную зависимость поглощения от H . Температурная зависимость поглощения определяется в основном зависимостью от температуры произведения $H_{c1} H_{c2} \approx H_c^2$, где H_c — критическое термодинамическое поле, для которого выполняется зависимость $H_c(T) = H_{c0}[1 - (T/T_c)^2]$. Следовательно, коэффициент γ зависит от температуры по закону $[1 - (T/T_c)^2]^{-2}$ (сплошная линия на рис. 1) и доста-

точно хорошо совпадает с экспериментальными точками в области температур, не слишком близкой к T_c .

Оценим абсолютную величину рассматриваемого эффекта. Полагая типичные для керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, значения $\lambda=10^{-5}$ см, $\sigma=10^4$ ($\Omega \cdot \text{см}$) $^{-1}$, $H_c=10^4$ Э, получаем во внешнем поле $H=1$ Э при $T=4.2$ К $R(H)=10^{-7}$ Ом, что не слишком сильно отличается от эксперимента с учетом грубого характера выполненных оценок.

Авторы благодарят Ю. М. Гальперина за обсуждение работы.

Л и т е р а т у р а

- [1] Reffori C., Dan Davidov, Belaish J., Felner J. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 7. P. 4028—4031.
- [2] Bhat S. V., Ganduly P., Rao C. N. R. // Pramana J. Phys. 1987. V. 28. N 14. P. L425—L429.
- [3] Мастеров В. Ф., Егоров А. И., Герасимов Н. П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46, № 7. С. 289—292.
- [4] Melvill P. H. // J. Phys. C. Sol. St. Phys. 1971. V. 4. N 17. P. 2833—2848.
- [5] Gittleman J. I., Rosenblum B. // Phys. Rev. Lett. 1966. V. 16. N 18. P. 734—736.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
20 июля 1988 г.

УДК 537.622.6 : 539.143.43

Физика твердого тела, том 31, в. 1, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 1, 1989

О СУЩЕСТВОВАНИИ СПИНОВОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ В ИТТРИЙ-КРЕМНИЕВЫХ ФЕРРИТАХ-ГРАНАТАХ

B. A. Бородин, B. D. Дорошев, Э. Н. Кузнецков, B. A. Рубан,
M. M. Савоста, T. H. Тарасенко

Интерес к исследованию магнитной структуры нескомпенсированных иттрий-кремниевых ферритов-гранатов $\text{Y}_3\text{Fe}_{8-x}\text{Si}_x\text{O}_{12}$, содержащих магнитоактивные ионы Fe^{3+} и Fe^{2+} , возник при обнаружении в этих магнетиках Геллером с сотрудниками методом эффекта Мессбауэра [1, 2] последовательности двух спонтанных ориентационных фазовых переходов (ОФП) II рода. Так, для составов $0.18 \leq x \leq 0.4$ при понижении температуры наблюдается ОФП от высокосимметричных магнитных фаз $\Phi_{(111)}$ к некоторым неидентифицированным угловым фазам Φ_{\angle} , а при дальнейшем понижении температуры в образцах с $0.25 \leq x \leq 0.4$ происходит второй ОФП к низкотемпературным фазам $\Phi_{(100)}$. Температуры этих ОФП, а следовательно, и вид $(x-T)$ -фазовой диаграммы были определены в работах [1, 2] на основании качественных наблюдений трансформаций мессбауэровских спектров с температурой, при этом количественная математическая обработка спектров не производилась. По-видимому, такой обработке препятствовало наличие ионов Fe^{2+} , для которых анизотропные составляющие сверхтонкого поля должны иметь резкую температурную зависимость, а также сложное катионное распределение.¹ Теоретическая интерпретация полученных результатов [1, 2] на основании одноионной модели Слончевского [3], удовлетворительно описывающей магнитную анизотропию ферритов, содержащих ионы Fe^{2+} , оказалась затруднительной.² Поэтому в работе [4] для объяснения ОФП в гранатах

¹ Согласно [2], нескомпенсированные иттрий-кремниевые гранаты содержат катионные и анионные вакансии, поскольку число ионов Fe^{2+} составляет $\sim 2/3$ от числа ионов Si^{4+} .

² Только малообоснованное предположение [2] о неоднородном распределении ионов Fe^{2+} по октаэдрическим позициям при высоких температурах позволяет объяснить плавную переориентацию.